

1. Record Nr.	UNISA996281111003316
Titolo	VTS : 2014 IEEE 32nd VLSI Test Symposium : 13-17 April 2014
Pubbl/distr/stampa	New York : , : IEEE, , 2014
ISBN	1-4799-2611-6
Descrizione fisica	1 online resource (260 pages)
Soggetti	Integrated circuits - Very large scale integration - Testing
Lingua di pubblicazione	Inglese
Formato	Materiale a stampa
Livello bibliografico	Monografia